Measurement & Control

渦流探傷用 WeldScan(ウェルドスキャン)プローブ





鉄鋼溶接部検査用 ウェルドスキャンプローブ (British and European Standard BS EN1711:2000)

主な特長

- 溶接部の金属疲労割れ検査に最適。(鉄鋼構造物(橋梁)・パイプ・タンク等)
- 溶接ビード上から熱影響部 (HAZ) までの表面クラック検査
- ペイント (2mm まで) を取除くことなく上から検査が可能
- 効率よく簡単に検査
- 各種(水中用、アルミ/ステンレス溶接用)プローブあり
- 渦流探傷法のメリット: 前処理、後処理、薬剤が不要で廃液なし。検査工数の低減。

WeldScan は鉄鋼溶接部の疲労割れを検出し、評価する ための渦流探傷技術です。

WeldScan は GE インスペクション テクノロジーズの商標名であり、これらのプローブは鉄鋼溶接部のフィールド検査を目的として開発され、磁気探傷(MPI 又は MT)に代わる検査方法です。

2mm 厚さまでの非導電性塗料(ペイント)から疲労割れを検出することができ、塗料を剥がす必要がなく経済的でもあります。

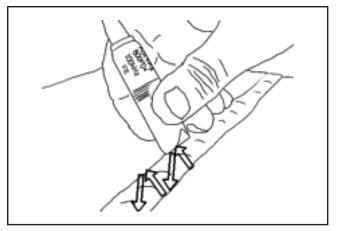
WeldScan プローブの特長として、溶接ビード部と熱影響部における材質の変化やリフトオフ効果を最小限にするため、バランスセンサーを一体化しています。

従って、塗料の厚さの変化や凹凸のある溶接表面を検査 する際に問題となるノイズを抑えます。

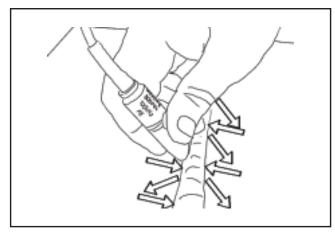
石油業界(とりわけ北海油田) においては高い評価が得られ、Lloyds Register, DNV (Det Norske Veritas), Bureau Veritas, PCN qualification system で認定されております。

WeldScan プローブには、アルミ及びステンレス用もあり、溶接部の検査にお役に立てることと考えています。 弊社の各渦流探傷器と共にご使用頂くことを推奨します。



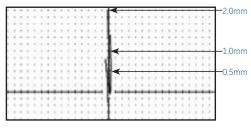


溶接ビード上の表面クラック検出の走査方向

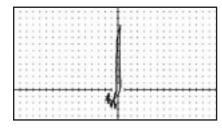


溶接部と母材間の熱影響部における表面クラック検出 の走査方向

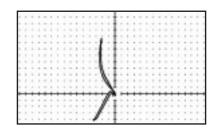
欠陥信号の波形表示例



テストブロック上の人工欠陥 (0.5, 1.0, 2.0mm ノッチ) の信号



溶接ビード上の欠陥信号



熱影響部 (HAZ) の欠陥信号

プローブの外観図



Straight WeldScan 800P Style Probe



90° Tip Inline 801P Style Probe



90° Tip Angle 802P Style Probe

プローブの選択 1011 15m 30m 50m 50m 100m 100m Straight Right Angles, in line Right Angles, 90" CONTACT SURFACE 150m Plastic 150m Waterproof 800P04JB1P 800P 04 J B CABLE TERMINATION 3 Way Cannon Disconnect 4 Way Lereo 6 Way Jacque 12 Way Lereo 7 Way Lereo 4 Way Amphenol Normal 100kHz Enhanced 100kHz, better signal performance but some lift-off signal shufti-Surface 100-606kHz, Steinless Steel, Abminium Enhanced 20kHz multi-ourface 9.5mm 16mm 04 32mm

GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ株式会社 非破壊検査機器営業本部

〒104-6023 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 23F Tel:03-6890-4567 Fax:03-6864-1738 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル 8F Tel:06-6260-3106 Fax:06-6260-3107

www.ge-mcs.jp/it geitjapan-info@ge.com お問い合わせは...

※ すべての仕様および外観は、予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。※ 本製品をご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。© 2012 General Electric Company. All Rights Reserved. GEIT-20204JP(12/04) 2012 年 4 月改訂